# 第30回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム 2018年11月10日

会場: TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 ホール 8A

#### 【基調講演】

13:00~13:45 「半導体テクノロジーへの期待と展望:これから20年先を見据えて」 東京大学 名誉教授・公益社団法人 応用物理学会 柴田 直

#### 【特別講演】

13:45~14:30 「イメージセンサの更なる進化」

ソニー株式会社 平山 照峰

14:45~15:15 「3D-stacked CMOS イメージセンサ技術の次世代イメージング応用」

東北大学大学院工学研究科 山下 雄一郎

15:15~15:45 「大規模アレイテスト回路を用いた局所的欠陥起因のゲート絶縁膜信頼性に関する研究」

東北大学大学院工学研究科 朴 賢雨

15:45~16:15 「すばらしい技術がなぜ新事業にならないのか? 一総合情報戦のすすめ一」

日経 BP 社 望月 洋介

#### 【特別講演】

16:30~17:15 「ビックデータの活用によるメモリ製造革新」

東芝メモリ(株) 赤堀浩史

17:15~18:00 「先進半導体センサ・デバイス開発プロジェクトの展開」

東北大学大学院工学研究科・未来科学技術共同研究センター 須川 成利

## The 30<sup>th</sup> International Microelectronics Conference Program

### Nov.10, 2018

Venue: TKP Garden City PREMIUM Sendai West, Hall 8A

[Keynote Speech] 13:00~13:45	"Prospects and Perspectives of Semiconductor Technology toward Twenty Years Ahead"  Professor Emeritus, The University of Tokyo APEX/JJAP
[Special Speech] 13:45~14:30	Tadashi SHIBATA "Further Evolution of Image Sensors"
2016	Sony Corporation Teruo HIRAYAMA
14:45 <b>~</b> 15:15	"3D-Stacked CMOS image sensor technology for advanced imaging"  Graduate School of Engineering, Tohoku University
15:15 <b>~</b> 15:45	Yuichiro YAMASHITA  "A Study of Gate Insulator Reliability due to Localized Defects Using Large Scale Array Test Circuit"  Graduate School of Engineering, Tohoku University  Hyeonwoo PARK
15:45~16:15	"Why does not a emerging technology become a new business?"  Nikkei Business Publications, Inc.  Yosuke MOCHIZUKI
[Special Speech] 16:30~17:15	"Utilization of Big Data for Innovation in Semiconductor Memory Manufacturing"  Toshiba Memory Corporation Hiroshi AKAHORI
17:15 <b>~</b> 18:00	"Progress of the Advanced Semiconductor Sensor and Devices Project"
	Graduate School of Engineering and New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University Shigetoshi SUGAWA